

掘削泥壁面への泥膜形成に関する考察

高知高専 正〇吉田泰治

" 正〇久谷亘

" 敦山幸二郎

1. まえがき：掘削泥壁面の安定機構を考えるうえで、いつも前提条件となっているものに掘削壁面に形成される泥膜（オルターケーキ）が、すでに存在していることである。では、この泥膜はどのようにして形成されるのであろうか、この点に言及している報告は少ない。そこで今報告はこの泥膜に着目し、これにして泥膜が形成されるについて検討を加えようとするものである。

2. 泥膜形成の一阶段：まず非粘性土地盤に対する泥水を使用して溝を掘削することを危険において初期の泥膜形成について考えてみよう。地盤掘削直後、掘削表面の土粒子は泥水方向へ移動しようとするが、泥水の粘性が高い（アヌル粘性で約50秒、清水の場合で約20秒）ことから、土粒子がさほど移動しなかつて、泥水で保持される様好になり泥水の水頭差による地盤側への浸透により、泥水とともに地盤側へと押しつけられ、その後泥水の地盤による浸透作用で土粒子個々をはへントナイト粒子で埋められ非常に薄い膜が形成される。

3. 泥膜の成長に対する考え方：以上のようにして出来た膜は放置時間とともに徐々に成長してゆき、掘削壁面に明確な泥膜が形成することになる。この成長について現在までに報告されていることは(1)泥水の地盤中への浸透作用による(J. Nash)⁽¹⁾と、(2)泥水浸透作用以外にヘントナイト粒子の電気泳動により成長が起る(C. Veder)⁽²⁾との考え方ある。まずJ. Nashの報告による泥水浸透作用のみ泥膜成長に寄与すると考えると、(1)式で泥膜厚さD⁽³⁾が求まる。ここでm:泥水表面濃度、n_c:泥膜充満率(=80%)、k_c:泥膜の透水係数($=2 \times 10^{-9} \text{ cm/sec}$)、h:泥水圧と地下水圧との水頭差。次に電気泳動による泥膜形成については、ドナンの膜平衡より、泥膜を境に濃度差のある泥水と地盤側では膜電位Eが発生し、その電位差E_cによりヘントナイト粒子の移動を起す、この際泥水側は(+)極、地盤側は(-)極と測定されるので、ヘントナイト粒子の地盤側への移動速度は(2)式で示される。ここでn:分散媒の粘性係数、ε:誘電率、λ:ヘントナイト粒子の界面動電圧(±50mV程度)である。

$$D = \sqrt{\frac{2 k_c m h}{1 - n_c}} \cdot \sqrt{t} \quad (1)$$

$$U = \frac{\epsilon \lambda}{4 \pi \eta} E \quad (2)$$

4. 泥膜形成実験と考察：ここで上記2説を検討するため図-1の装置により泥膜形成実験を試みた。その結果を図-2に泥膜厚さDとE_cの関係を示し、その所発生する電位をE_c～log tで図-3に示した。

これによると、泥水と地盤側との発生電位はとも大きくなると徐々に減少し一定値に漸近する。

しかし、泳動現象による膜成長であれば、泥膜厚さDはE_cに比例しないことはない。しかし図-2で示したようにDはE_cに比例しておりヘントナイト粒子の電気泳動による泥膜成長への寄与はかなり大きいことになるようだ。又図-2の関係から(1)式が支持されるようと思われる、しかし、水頭差による浸透漏過作用を卓越しているのであれば、水頭差の小さい所では薄い泥膜、水頭差の大きい位置では厚い泥膜となりねばならず、図-2で示しているように泥膜の上と下とでは泥膜厚さはさほど変化しておらず、あまり水頭差には関係しないようであ

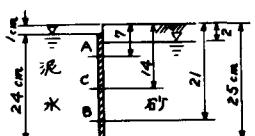
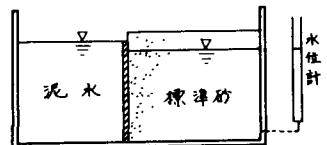


図-1 実験条件及び装置

3. (実際の現場報告でも、この差は明確ではない) いま(1)式を用いて各実験位置での泥膜厚さ D を計算してみると、 $m=3\%$ であるから 72 時間放置後、 $Z=7\text{cm}$ の所では $D=0.24\text{mm}$ 、 $Z=21\text{cm}$ で $D=0.27\text{mm}$ となり、図-2 の測定値と比較して全体の泥膜厚さはかなり薄くなくてはいけないことがある。

5. ベントナイト粒子の凝集効果による膜成長

上記2つの項目で説明のついた部分について、初期に形成された薄い泥膜に、泥水中のベントナイト粒子が接触し直後、泥膜に粒子が凝集すると考えてみる。

フィックスの拡散方程式を用いて泥水濃度 C を求めると、(3)式となる。ここで D_L : 拡散係数、 X : 膜面を $X=0$ として膜に垂直な方向とする。

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_L \frac{\partial^2 C}{\partial X^2} \quad (3)$$

これを境界条件 $X=0$ で $C=0$ 、 $X=L$ で $\partial C/\partial t=0$ 、初期条件 $t=0$ で $C=C_0$ として解くと、 $X=L$ での濃度

$$C = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2C_0}{m} \left(\sin \frac{m}{L} X \right) e^{-\left(\frac{m}{L}\right)^2 D_L t} \quad (4)$$

は(4)式となる。初期濃度 C_0 から C に変化した方が膜厚が成長したとする、 $\Delta D = UC_0 L / (1 - \eta_c)$ となる。

$$U = \frac{C_L - C_0}{C_0 L} = 1 - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2}{m^2} e^{-\left(\frac{m}{L}\right)^2 D_L t} \quad (5)$$

(5)式は七又小さい範囲では $U = (2/L)\sqrt{D_L t / \pi}$ で近似できることから $\Delta D = \alpha \sqrt{t}$ なる関係式を得られる。

一般に膜に引きつけられた粒子がすべて膜に凝集するとは考えられないもので、この凝集は緩慢凝集となり、かなり長時間にはほぼ比例するところであろう。一般に振動後放置時間は長くて2日程度だから、その間の膜成長は \sqrt{t} に比例すると考えても良いだろう。これを確認する意味で泥水中に泥膜を付着させた濾紙をつぶし、泥膜成長を調べた結果を図-2 中に示しているが他の要因なしに泥膜は成長していく。(泥膜を付着させない濾紙では泥膜は出来なかつた。)

6. 結論： 現段階では泥膜は泥水の浸透濾過による成長以外にベントナイト粒子の界面性質による影響が考えられ、ここで緩慢凝集も1つの成長要因であろうと考えられるが、この量的検討は今後残された問題である。

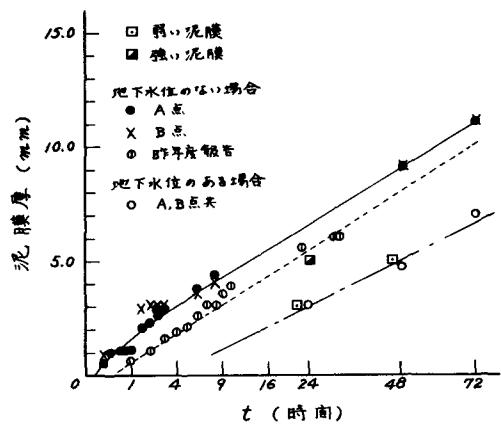


図-2 泥膜の成長

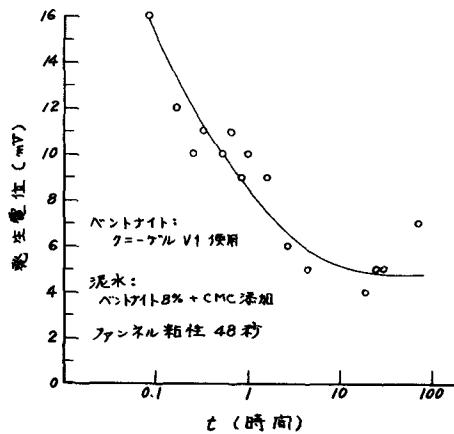
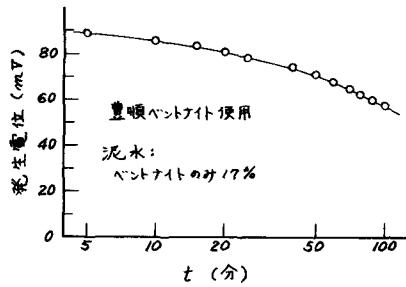


図-3 発生電位

- (1) J.Nash, "Stability of Trenches Filled with Fluids" CO-4, ASCE, 1974, PP.533-542,
- (2) C.Veder, "An Investigation on the Electrical Phenomena at the Area of Constant bentonit Muds and Cohesionless Materials" Proc. 5th Int. Conf. on SMFE, 1961,
- (3) 吉田・大曾・秋山, "濾剤泥壁面への土圧評価" 第32回中国・四国工芸学会講演概要集, PP. 222~223, 1980.